

# SCAN TECH 2024のお知らせ

2024/6

公益社団法人 日本顕微鏡学会  
走査電子顕微鏡分科会

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今年度は、「柔剛ともによく制す ～達人に聞く！試料前処理と観察技術の最前線～」をテーマとして SCAN TECH 2024 を開催することになりました。各分野の最前線でご活躍の方々に講演をお願い致しました。具体的な内容は裏面のプログラムをご覧ください。さらに、講演会終了後のポスターセッション&フリートーキングでは、講師やスタッフあるいは参加者同士が自由に討議できる時間を確保してあります。

## 記

1. 主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会 走査電子顕微鏡分科会
2. 日時：2024年8月30日（金） 10:00～18:30
3. 場所：東京都市大学 世田谷キャンパス 2号館  
（東京都世田谷区玉堤 1-28-1）  
交通 ・東急大井町線 尾山台下車：徒歩 12 分  
・東急東横線/東急多摩川線 多摩川駅下車→東急バス（二子玉川駅行）東急ゴルフパークたまがわ前・東京都市大南入り口下車：徒歩 3 分  
・東急田園都市線 二子玉川駅下車→東急バス（多摩川駅行）東急ゴルフパークたまがわ前・東京都市大南入り口下車：徒歩 3 分  
・東急東横線 田園調布駅下車→東急バス（千歳船橋駅行）東京都市大北入り口下車：徒歩5分
4. 参加費（予稿集含む）：予稿集は PDF ファイルをダウンロード  
：日本顕微鏡学会会員 3,000 円（税込）、非学会員 6,000 円（税込）  
：学生 無料
6. 登録方法：分科会ホームページ：<https://scantech.jp>（6月中旬より受付開始予定）
7. 登録締切：2024年7月31日（水）  
（当日の参加登録は受け付けておりませんのでご注意ください。）

周囲に関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。  
なお、最新の情報は走査電子顕微鏡分科会のホームページをご覧ください。

URL：<http://scantech.jp>

来年度の案内を E-mail でご希望の方は、[yokoe@jfcc.or.jp](mailto:yokoe@jfcc.or.jp) までご連絡下さい。

# SCAN TECH 2024

## 柔剛ともによく制す

～達人に聞く！試料前処理と観察技術の最前線～

日時：2024年 8月30日（金）10:00～18:30

場所：東京都市大学 世田谷キャンパス

開会挨拶（10:00～10:10）

豊岡 公德（理化学研究所）

基礎講座（10:10～11:40）

1. SEM像で何が見えるのか？検出器毎のアクセプタンスの理解と像解釈

小田 武秀（カールツァイス）

2. 現代SEM分析道の心得

三井 千珠（オックスフォードインストゥルメンツ）

3. 高分子材料の試料調製 - トレース（模倣）のための必要条件

丹羽 博嗣（三菱ケミカル）

ポスター・企業展示&休憩（11:40～13:00）

トピックス（13:00～13:30）

4. 根圏電顕イメージング：柔剛生物試料を観る断面研磨SEM法の開発

豊岡 公德（理化学研究所）

応用講座1（13:30～14:50）

5. EPMAを用いた高分解能軟X線発光分光測定による

原子力・核融合炉材料中の軽元素化学状態分布分析

笠田 竜太（東北大学）

6. in-situ 充放電SEM観察・分析技術

～全固体電池Si負極における充放電過程の解析～

山本 康晶（日本電子）

ポスター・企業展示&休憩（14:50～15:30）

応用講座2（15:30～16:50）

7. 走査電子誘電率顕微鏡による溶液中の生物試料やナノ粒子の直接観察と分析

小椋 俊彦（産業技術総合研究所）

8. FIB-SEM シリアルセクションング - 観察・解析技術の現状と課題 -

原 徹（物質・材料研究機構）

閉会挨拶

横江 大作（JFCC）

ポスター&企業展示、フリートーキング（～18:30）